半导体物理

课后作业09

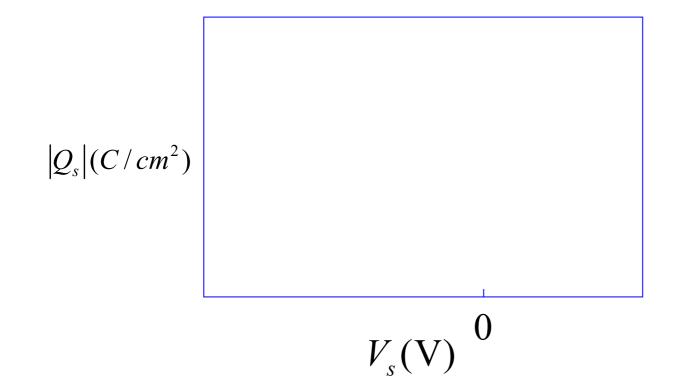
主讲人: 蒋玉龙

微电子学楼312室,65643768

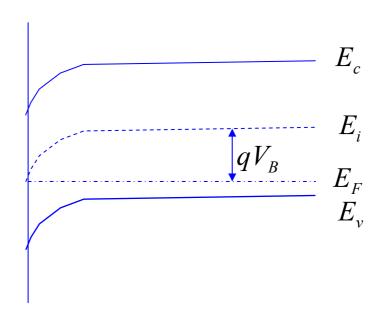
Email: yljiang@fudan.edu.cn

http://10.14.3.121

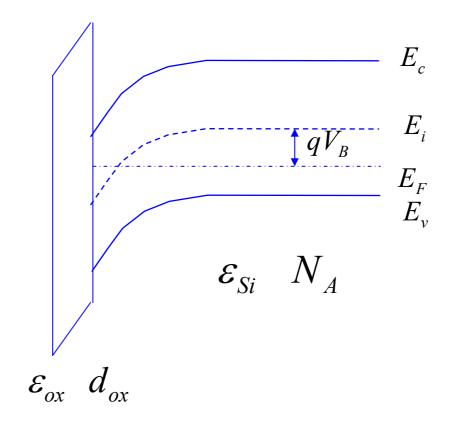
1、画出n型Si的空间电荷层电荷面密度Qs与其表面势Vs的对应关系,并标出空间电荷层各个状态对应的Vs区间。(Qs使用自然对数坐标,参考课本202页的图)



2、用最直观、简单的方法推导出室温下掺杂浓度为N_A的p型Si表面恰为本征时的表面电场强度、表面电荷密度和表面层电容的表达式。



3、用最直观、简单的方法导出室温下p-Si衬底对应的理想MIS结构的开启电压表达式。(Si介电常数为 ϵ_{Si} ,掺杂浓度为 N_A ,SiO₂层介电常数为 ϵ_{ox} ,厚度为 d_{ox})



4、用n型Si单晶片做为衬底制备MIS电容。金属电极使用AI,面积为1.6E-7m²,功函数为4.25eV。绝缘层采用SiO₂,相对介电常数3.9。在200°C下做高频正负偏压B-T实验,测量所得C一V曲线如图所示。求该SiO₂中的可动电荷面密度。

